

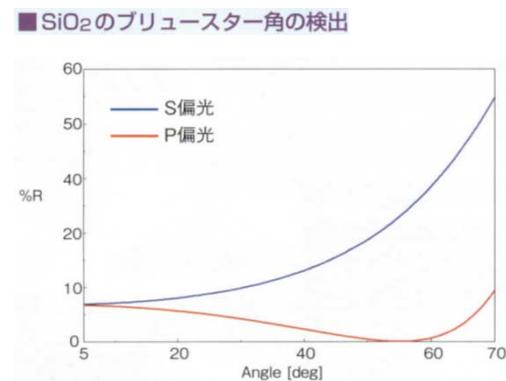
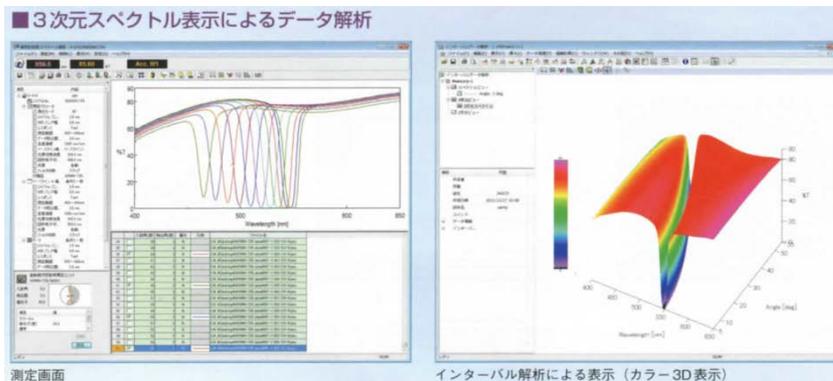
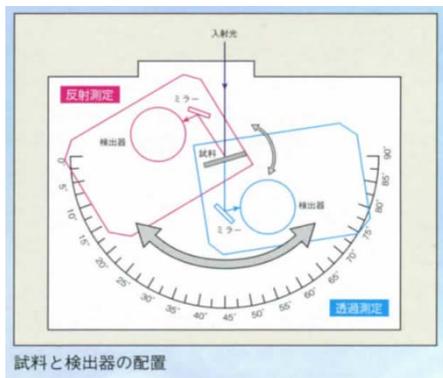
角度分解絶対反射率測定装置



日本分光(株): V-650 (ARMV-734装着)

試料への入射角・受光角を変化させながら、分光反射率及び、透過率を測定

布帛、太陽電池部材、半導体、薄膜、光学素子、光デバイスなど各種固体試料の分光特性や膜厚などの測定に使用できる。



入射角と受光角は、個別に設定でき、自動で複数の角度による連続測定が可能
P 偏光と S 偏光の指定や偏光子の角度の任意設定により、偏光特性を調べることも可能